

Part 4 サンビーム成果発表一覧

2016 年度下期～2017 年度上期

発表形式

- 1 : 原著論文／博士論文／査読付きプロシーディングス
- 2 : 総説
- 3 : 査読なしプロシーディングス
- 4 : 単行本
- 5 : 賞
- 7 : その他の出版物
- 8 : 招待講演
- 9 : 口頭／ポスター発表
- 10 : SPring-8 利用研究成果集
- 11 : 公開技術報告書
- 12 : プレス発表／取材（新聞、テレビ、雑誌等々マスコミ関係取材）

SB No. : サンビーム成果登録番号

JASRI No. : JASRI 研究成果番号



サンビーム成果発表一覧 発表形式 1, 10, 11

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目		筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]		
11	932	33776	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	耐熱合金表面の酸化物生成挙動の評価	根上 将大	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.25-28 [2017/3]		川崎重工業(株)
11	933	33777	2014B5310, 2015A5310 2015B5310, 2016A5310	ガス雰囲気変動下における三元触媒中の酸化セリウムの価数評価(2)	中山 耕輔	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.29-32 [2017/3]		川崎重工業(株)
1	934	34063	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	Development of highly durable thermal barrier coating by suppression of thermally grown oxide	根上 将大	
				Proceedings of the ASME Turbo Expo 2017, Paper No. GT2017-64046 (2017)		川崎重工業(株)
1	935	34392	2015A5020	引張り試験によるスケール密着性評価	山田 遥平	
				日本金属学会誌 Vol.81, No.4, 206-210 (2017)		(株)神戸製鋼所
11	936	34377	2015A5020, 2015B5020	硬X線光電子分光法を用いたアルミ合金上の自然酸化膜の測定	北原 周	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.33-37 [2017/3]		(株)コベルコ科研 (株)神戸製鋼所
11	937	34014	2015A5320, 2015B5320 2016A5320	XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価(3)	横溝 臣智	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.38-41 [2017/3]		(株)コベルコ科研 (株)神戸製鋼所
11	938	33401	2015A5330	燃料電池電解質のNi拡散評価	上村 重明	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.51-55 [2017/3]		住友電気工業(株)
11	939	33421	2014B5330, 2015A5030 2015B5330	ナトリウムイオン電池のサイクル特性向上機構の解析(1): XRD	徳田 一弥	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.42-45 [2017/3]		住友電気工業(株)
11	940	33422	2014B5330, 2015B5330	ナトリウムイオン電池のサイクル特性向上機構の解析(2): XAFS	徳田 一弥	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.46-50 [2017/3]		住友電気工業(株)
1	941	18247	C02B16XU-3018-N C04A16XU-3030-N C04B16XU-3031-N C05A16XU-3031-N 2005A0373, 2005B0959 2005B5031, 2006A5030 2006A5331, 2006B5031 2007A5031, 2007B1824 2007B5030, 2008B2112 2008B5030, 2009A5030 2009B5030, 2010A5030	Synchrotron Radiation X-ray Diffraction Analysis for Bi-based Oxide Superconducting Wire	上村 重明	
				Diamond Light Source Proceedings 1, p.108 (2010)		住友電気工業(株)
1	942	33989	2013A1318, 2012A1108 2012A5030	Time-Resolved Micro-Beam X-Ray Absorption Fine Structure (XAFS) Measurement to Investigate the Cause of a Current Collapse of GaN-HEMTs	舘野 泰範	
				2016 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, p.7751073 (2016)		住友電気工業(株)
11	943	33571	2014A5040, 2014B5040 2015A5040	充電状態におけるLiCoO ₂ 薄膜正極表面層のHAXPES解析	細井 慎	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.56-58 [2017/3]		ソニー(株)
11	944	33572	2014A5340, 2014B5340 2015A5340	リチウムイオン二次電池正極活物質のin situ XAFS解析	後藤 習志	
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.59-61 [2017/3]		ソニー(株)

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]	
1	945	34028	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050 2015A5050, 2015B5050	SPring-8放射光によるガスタービン動翼材のクリープ損傷評価	向井 康博 関西電力(株)
				火力原子力発電大会論文集 [2017/4]	
11	946	33614	2014B5050, 2015A5050 2015A1664, 2015B5050 2016A5050	Ni基超合金の引張変形挙動に及ぼす試験温度の影響	向井 康博
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.62-64 [2017/3]	関西電力(株)
11	947	34045	2014B5350, 2015A5350 2015B5350	蛍光XAFS法を用いた脱硫石膏中セレンの化学形態分析	秋保 広幸
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.65-68 [2017/3]	(一財)電力中央研究所
1	948	34241	2006B5351, 2007A5051 2007B5350, 2008A5350 2008B5350, 2011B5350 2012A5351, 2012B5350 2013A5350, 2013B5350 2014A5350, 2014B5350	火力環境分野への放射光XAFSの適用～蛍光XAFSによる微量なセレンと水銀の化学形態分析～	秋保 広幸
				日本放射光学会誌「放射光」30(4), 175 (2017)	(一財)電力中央研究所
11	949	33796	2015A5060, 2015B5060 2016A5060	硬X線光電子分光法による半導体積層構造の深さ方向分析	吉木 昌彦
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.69-72 [2017/3]	(株)東芝
11	950	33824	2015A5360, 2015B5360 2016A5360	リチウムイオン二次電池負極上の正極溶出物質のX線吸収微細構造解析	盛本 さやか
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.73-75 [2017/3]	(株)東芝
1	951	33551	2005B0232, 2006A1641 2006B1599, 2007A1908 2007B1840, 2007B1933 2006B5360, 2007A5360 2007B5360	The Development of Phase-Change Optical Recording Media and The Analysis of the Interface Layer Effect to Phase-Change Recording Film	中居 司
				博士学位論文(大阪大学) [2017/3/22]	(株)東芝
1	952	34558	2007B1840, 2006A5360 2006B5360, 2007A5360 2007B5360	GeBiTe相変化膜におけるBi LIII吸収端のXAFS解析	中居 司
				日本材料学会 材料 66(9), 648 (2017)	(株)東芝
1	953	34747	2014B5370, 2015A5370 2015A7012, 2015B7112 2016A7112	Characterization of secondary pores in washcoat layers and their effect on effective gas transport properties	加藤 悟
				Chemical Engineering Journal 324, 370-379 (2017)	(株)豊田中央研究所
1	954	34749	2014B5370, 2015A5370 2015A5371, 2015A7012 2015B7112, 2016A7112 2016B7031	Analyzing Gas Transport Phenomena in Secondary Pore of Washcoat Layer Determined by X-ray CT and Modelling	加藤 悟
				CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 57, pp.1237-1242 (2017)	(株)豊田中央研究所
11	955	33649	2014B5071, 2015A5071 2015B5071, 2016B5071	リチウム二次電池負極被膜のHAXPES分析	高橋 直子
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.76-79 [2017/3]	(株)豊田中央研究所
11	956	33700	2012A5371, 2013A5370 2014A5370, 2014B5371	溶液法高品質4H-SiCバルク単結晶のX線トポグラフィによる評価	山口 聡
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.80-83 [2017/3]	(株)豊田中央研究所
11	957	34085	2014B5380, 2015A5080 2015B5080	完全結晶に近い高結晶性試料のX線回折測定	宮野 宗彦
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.84-87 [2017/3]	日亜化学工業(株)
11	958	34084	2015A5380, 2015B5380 2016A5380	偏光XAFS及びFEFFを用いたInGaN結晶のIn分布可視化(2)	吉成 篤史
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.88-92 [2017/3]	日亜化学工業(株)

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]	
1	959	35154	2014B5091, 2015A5390, 2015B5091	高容量二次電池を目指したSi系負極に適した電解質の研究	竹川 寿弘 日産自動車(株)
				博士学位論文(横浜国立大学) [2016/3/24]	
11	960	33377	2015B5090, 2016A5092	オペランド共焦点XRDによるリチウムイオン二次電池の反応分布解析	高尾 直樹 (株)日産アーク
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.93-95 [2017/3]	
11	961	33379	2015A5392, 2015B5092, 2015B5390, 2016A5091, 2016A5390	燃料電池用新規 Pt系触媒の構造解析及び電子状態計測	青木 誠 山梨大学 (株)日産アーク
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.96-98 [2017/3]	
11	962	33704	2015B5120, 2016A5120	硬X線光電子分光およびin-plane X線回折による固体電解質/正極活物質界面の解析	大内 暁 パナソニック(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.99-102 [2017/3]	
11	963	33703	2015B5420, 2016A5420	Pd含有多孔質材料のX線吸収微細構造測定	上野 巖 パナソニック(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.103-106 [2017/3]	
1	964	34086	2015B5420, 2016A5420	Dynamic Fluctuation in Heat Treatment Time Dependence of Activity and Reaction Kinetics of Active Centers in Fe/N/C Oxygen Reduction Reaction Catalyst	鄭 豪 パナソニック(株)
				ChemistrySelect 1, 5440-5444 (2016)	
1	965	34644	2016A5110, 2016A5410, 2016B5110, 2016B5410	Control of La-doped Pb(Zr,Ti)O ₃ crystalline orientation and its influence on the properties of ferroelectric random access memory	Wensheng Wang 富士通セミコンダクター(株)
				Jpn. J. Appl. Phys. 56, 10PF14 (2017)	
11	966	34763	2015A5110, 2015A5410, 2015B5110, 2015B5410	BaTiO ₃ ナノ粒子膜の放射光による構造評価	淡路 直樹 (株)富士通研究所
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.118-123 [2017/3]	
11	967	33807	2014A5410, 2014B5410, 2015B5410	高次Co化合物被膜 Ni(OH) ₂ によるニッケル水素電池の高耐久化	土井 修一 (株)富士通研究所
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.124-127 [2017/3]	
11	968	33343	2013B5430, 2014A5430, 2014B5430, 2014B5131, 2015A5430, 2015A5131, 2015B5430, 2015B5131, 2016A5430, 2016A5131	酸化物半導体薄膜の構造・電子状態解析	本谷 宗 三菱電機(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.128-131 [2017/3]	
11	969	33374	2015A5431, 2015B5431	サンビームにおける冷凍食品中氷粒子の3D観察技術開発	須藤 和幸 三菱電機(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.6 2016, pp.132-134 [2017/3]	

サンビーム成果発表一覧 発表形式 2~9, 12

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]	
5	970	34036	2013B5010, 2014A5010	積層造形品の残留応力評価	日比野 真也 川崎重工業(株)
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会 優秀発表賞) S-02 [2016/9/7-8]	
9	971	34883	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	Development of highly durable thermal barrier coating by suppression of thermally grown oxide	根上 将大 川崎重工業(株)
				ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition [2017/6/26-30]	
9	972	34083	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	酸化物層の成長抑制による遮熱コーティングの長寿命化	根上 将大 川崎重工業(株)
				耐熱合金材料第123委員会 平成29年7月期研究会	
9	973	34247	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	耐熱合金表面の酸化物生成挙動の評価	根上 将大 川崎重工業(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) SO-5/S-25 [2017/8/31-9/1]	
9	974	34248	2016B5310, 2017A5310	排ガス浄化触媒のin-situ XAFS評価	中山 耕輔 川崎重工業(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-24 [2017/8/31-9/1]	
9	975	34774	2016A5020, 2016B5020	HAXPESを用いたAl合金表面の改質と変質挙動の評価	北原 周 (株)コベルコ科研
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-22 [2017/8/31-9/1]	
9	976	34773	2016A5320, 2016B5320	XAFSを用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響評価	横溝 臣智 (株)コベルコ科研
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-23 [2017/8/31-9/1]	
9	977	33397	2016A5030,2016B5031	熱処理中その場 X線回折測定による α -Si/Ge薄膜中ナノ結晶の観察	足立 真寛 住友電気工業(株)
				春季 応用物理学会学術講演会 [2017/3]	
2	978	34219	2005A0373-NI-np-TU C05A16XU-3031-N 2005B5031, 2006A5030	Development of Method for Analyzing Sintering Reaction of Bi-Based Oxide Superconducting Wires Using SPing-8	飯原 順次 住友電気工業(株)
				SEI Technical Review 66, 68-72 (2008) [2008/04]	
2	979	34218	2009A5031	Non-destructive Analysis for Metal/Glass Interface Using Synchrotron Radiation	飯原 順次 住友電気工業(株)
				SEI Technical Review 77, 137-140 (2013) [2013/10]	
9	980	34104	(調整作業)	サンビーム設備更新報告1 ID単色器の液体窒素冷却化	飯原 順次 住友電気工業(株)
				第8回サンビーム研究発表会(第5回SPring-8産業利用報告会) S-01 [2008/9/18-19]	
9	981	34105	2008B5330, 2008A1919	XAFS法を用いたタングステンめっき浴中のイオン状態解析	飯原 順次 住友電気工業(株)
				第8回サンビーム研究発表会(第5回SPring-8産業利用報告会) S-12 [2008/9/18-19]	
9	982	34106	2009A5031	X線回折法による金属ガラス界面酸化物の非破壊分析法の開発	飯原 順次 住友電気工業(株)
				第9回サンビーム研究発表会(第6回SPring-8産業利用報告会) S-12 [2009/9/3-4]	
9	983	34115	2015B5030, 2015B1870 2016A5031, 2016B5030	硬X線光電子分光による金属/高分子界面の密着機構の調査	久保 優吾 住友電気工業(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) SO-4/S-20 [2017/8/31-9/1]	
9	984	34114	(調整作業)	サンビームによるX線異常分散回折測定技術の開発(2)	徳田 一弥 住友電気工業(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回 SPring-8産業利用報告会) S-27 [2017/8/31-9/1]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]	
9	985	34254	2016A5030, 2016B5031 2017A5031	その場X線回折による薄膜中ナノ結晶成長過程の観測	豊島 遼 住友電気工業(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-21 [2017/8/31-9/1]	
9	986	34233	C03B16B2-4003-N C04A16B2-4030-N C04B16B2-4030-N C05A16B2-4030-N 2005B0799	X線散乱、XAFS、MDシミュレーションを用いた増幅用ファイバの構造解析	斎藤 吉広 住友電気工業(株)
				第8回サンビーム研究発表会(第5回SPring-8産業利用報告会) S-11 [2008/9/18-19]	
9	987	34234	C03B16B2-4003-N C04A16B2-4030-N C04B16B2-4030-N C05A16B2-4030-N 2005B0799	X線散乱/XAFS分析とシミュレーションによる増幅用ファイバ解析	斎藤 吉広 住友電気工業(株)
				第9回サンビーム研究発表会(第6回SPring-8産業利用報告会) S-11 [2009/9/3-4]	
5	988	31934	2006A5031, 2009A1916	グラファイト結晶含有DLC膜の形成方法	斎藤 吉広 住友電気工業(株)
				平成26年度近畿地方発明表彰(発明奨励賞) [2014/11/14]	
8	989	22128	C02B16XU-3018-N C04A16XU-3030-N C04B16XU-3031-N 2006A5331, 2006B5031 2007A5031, 2007B1824 2007B5030, 2008B2112 2008B5030, 2009A5030 2009B5030, 2010A5030	Bi系高温超電導線材の解析	山口 浩司 住友電気工業(株)
				中性子産業応用セミナー [2012/08/08]	
5	990	34246	2010B5330, 2010A5330 2010A1707, 2009B1800 2009B2050, 2009A5330 2008B2008	超硬製品層からのタングステンのリサイクルシステム構築	飯原 順次 住友電気工業(株)
				平成25年度 資源循環技術・システム表彰 レアメタルリサイクル賞	
9	991	34740	2015B5340, 2016A5340 2016B5340	リチウムイオン二次電池LiCoO ₂ 正極のXAFS解析	稲葉 雄大 ソニー(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-19 [2017/8/31-9/1]	
7	992	33606	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050	X線回折法によるガスタービン動翼用Ni基超合金のクリープ損傷評価	向井 康博 関西電力(株)
				電気情報社「電気現場」2017年1月号 [2017/1]	
7	993	34061		SPring-8(スプリング・エイト)ってこんなところですよ!	立松 正幹 関西電力(株)
				R&D News Kansai 2017年6月号 [2017/6]	
9	994	34257	2015A5050, 2015B5050 2016A5050, 2016B5050 2017A5050	Ni基超合金の変形挙動に及ぼす γ/γ' 微視組織の影響	向井 康博 関西電力(株)
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-17 [2017/8/31-9/1]	
9	995	33607	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050	大型放射光施設“SPring-8”とその活用事例	出口 博史 関西電力(株)
				第308回電気材料技術懇談会 [2017/03]	
9	996	33613	2013A5050, 2013B5050 2014A5050, 2014B5050 2015A5050, 2015B5050	SPring-8放射光によるガスタービン動翼材のクリープ損傷評価	向井 康博 関西電力(株)
				平成28年度火力原子力発電大会 [2016/10]	
8	997	33785	2012A5351, 2012B5350 2013A5350, 2013B5350	個体酸化物形燃料電池の評価分析について	山本 融 (一財)電力中央研究所
				第5回SPring-8グリーンサステナブルケミストリー研究会 [2016/12]	
9	998	34046	2014B5350, 2015A5350 2015B5350	蛍光XAFS法を用いた脱硫酸石膏中セレンの化学形態分析	秋保 広幸 (一財)電力中央研究所
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会) S-09 [2016/9/7-8]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]	
7	999	34062	2016A5350	SPring-8を活用した分析技術の開発と多様な物質の化学形態の解明	三好 加奈子 (一財)電力中央研究所
				電力中央研究所 所内報クリープア2016年秋号, Vol. 350, p.8-9 [2016/10]	
9	1000	34067	2015A5350, 2015B5350	XAFS測定によるリチウムイオン電池の混合正極における劣化反応解析	小林 剛 (一財)電力中央研究所
				第16回サンビーム研究発表会(第13回SPring-8産業利用報告会) S-10 [2016/9/7-8]	
7	1001	34243	2014B5350, 2015A5350 2015B5350	未来への叡智	秋保 広幸 (一財)電力中央研究所
				日経サイエンス, Vol.47, No.9, p.1 [2017/7]	
9	1002	34684	2016A5350, 2016B5350	XAFSによる微量元素の化学形態分析	山本 融 (一財)電力中央研究所
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-18 [2017/8/31-9/1]	
9	1003	33771	2015A5060, 2015B5060 2016A5060, 2016B5060	硬X線光電子分光法(HAXPES)によるMOCVD法形成ゲルマニウムスズ薄膜の化学結合状態解析	臼田 宏治 (株)東芝
				電子デバイス界面テクノロジー研究会(第22回) [2017/01/19-21]	
9	1004	33770	2015A5060, 2015B5060 2016A5060, 2016B5060	硬X線光電子分光法(HAXPES)によるゲルマニウムスズ薄膜の深さ方向化学結合状態評価(II)	臼田 宏治 (株)東芝
				春季 応用物理学会学術講演会 [2017/3/14-17]	
9	1005	34560	2015B5060, 2016A5060 2016B5060	サーファクタント効果利用MOCVD成長GeSn薄膜のHAXPES解析	臼田 宏治 (株)東芝
				第17回 サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-14 [2017/8/31-9/1]	
9	1006	34655	2016A5360, 2016B5360	次世代磁気抵抗メモリ向けタンゲステン薄膜の局所構造解析	藤井 景子 (株)東芝
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-15 [2017/8/31-9/1]	
9	1007	34707	2016A5360	リチウムイオン二次電池負極上の正極溶出物質のXAFS解析	盛本 さやか (株)東芝
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-16 [2017/8/31-9/1]	
9	1008	34561	2015A5060, 2015B5060 2016A5060, 2016B5060	サーファクタント効果を利用したMOCVD成長GeSn薄膜のHAXPES評価	臼田 宏治 (株)東芝
				秋季 応用物理学会学術講演会 [2017/9/5-8]	
8	1009	33795	2006B5360, 2007A5360 2007B5360, 2007B1840 2007B1933	高速相変化材料と界面層効果の解析	中居 司 (株)東芝
				SPRUC研究会(機能性材料ナノスケール原子相関・放射光赤外・不規則系物質先端科学合同研究会) [2013/9/6-7]	
9	1010	34738	2016A5070, 2016B5070	SR-XRFによる極微量貴金属の分析	小坂 悟 (株)豊田中央研究所
				第17回 サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-12 [2017/8/31-9/1]	
9	1011	34754	2016A5071, 2016B5071 2017A5071	HAXPESによるトライボ表面の分析	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-13 [2017/8/31-9/1]	
9	1012	32363	2015B1649, 2016A5071	HAXPESによるトライボ表面の分析	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				X線分析討論会 [2016/10/26-28]	
9	1013	33651	2016A5071	放射光を用いたトライボ表面の解析	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				2016真空・表面科学合同講演会 [2016/11/29-12/1]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]	
9	1014	34744	2011B5370, 2012A5370 2013B5370, 2014A5370 2014B5371, 2015A5371 2015B5370	Development of a Nuclear Emulsion Plate for X-ray Topography International Conference on Materials and Systems for Sustainability 2017 [2017/9/29-10/1]	山口 聡 (株)豊田中央研究所
9	1015	34745	2014B5370, 2015A5370 2015A5371, 2015A7012 2015B7112, 2016A7112 2016B7031	排気浄化触媒リアクターの時間-空間分解解析 6 —触媒層の細孔特性が層内ガス流れに及ぼす影響— 第120回触媒討論会 [2017/9/12-14]	加藤 悟 (株)豊田中央研究所
9	1016	34746	2014B5370, 2015A5370 2015A5371, 2015A7012 2015B7112, 2016A7112 2016B7031	排気浄化触媒リアクターの時間-空間分解解析 7 —FIB-SEMによる細孔構造の高空間分解能解析. 解析手法主体として— 第120回触媒討論会 [2017/9/12-14]	松岡 世里子 (株)豊田中央研究所
5	1017	34029	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	放射光マイクロビームX線による高効率LED発光層の評価 第15回サンビーム研究発表会(第12回SPring-8産業利用報告会 最優秀発表賞)SO-2/S-09 [2016/9/3-4]	榊 篤史 日亜化学工業(株)
8	1018	34631	2014A5080, 2014B5080 2015A5080	放射光マイクロビームX線によるInGaN系材料の評価 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会第154回研究会 [2017/8/29]	榊 篤史 日亜化学工業(株)
9	1019	34632	2016A5380, 2016B5380 2017A5380	InGaN/GaN量子井戸における下地基板の影響評価 第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-10 [2017/8/31-9/1]	榊 篤史 日亜化学工業(株)
9	1020	34546	2016A5080, 2016B5080	サファイア層に埋もれた界面のX線回折測定 第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-11 [2017/8/31-9/1]	宮野 宗彦 日亜化学工業(株)
8	1021	34790	2016B5390	放射光を利用した電池材料の構造解析 若手研究者向け講演会・大学院生研究成果発表会 [2017/3] あいちシンクロトン光センター	伊藤 孝憲 (株)日産アーく
9	1022	34785	2016B5390, 2017A5390	Structural Effects on Oxygen Reduction Activity of Carbon-Free Connected Platinum-Iron Nanoparticle Catalysts PRIME2016 [2016/10]	黒木 秀記 東京工業大学 (株)日産アーく
9	1023	34787	2015A5392, 2015B5092 2015B5390, 2016A5091 2016A5390	安定化PtスキんPtCo合金触媒の微細構造と酸素還元反応 第57回電池討論会 [2016/11]	矢野 啓 山梨大学 (株)日産アーく
9	1024	34788	2015B5090, 2016A5092	18650型リチウムイオン二次電池の劣化現象:正極材不均一反応解析 第57回電池討論会 [2016/11]	馬場 輝久 (株)日産アーく
9	1025	34789	2016B5390	18650型リチウムイオン二次電池の劣化解析:正極における不均一な劣化現象と結晶構造 電気化学会第84回大会 [2017/3]	伊藤 孝憲 (株)日産アーく
9	1026	34792	2015B5090, 2016A5092	オペランド高エネルギー共焦点XRDによる円筒電池の反応分布解析 自動車技術会2017年春季大会 [2017/5]	馬場 輝久 (株)日産アーく
9	1027	34547	2015A5390, 2015B5091 2016A5091	HAXPESを用いたLiイオン電池におけるSi系負極の表面分析 第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-09 [2017/8/31-9/01]	高橋 伊久磨 日産自動車(株)
9	1028	34640	2015B3388, 2016A1805 2016A5390, 2016B5390	燃料電池用新規アノード触媒のXAFSによるCO吸着解析 第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-08 [2017/8/31-9/01]	矢野 啓 山梨大学 (株)日産アーく

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目		筆頭者氏名 所属
				発表先 [日付]		
9	1029	34727	2015A5120	全固体電気二重層電界効果による金属薄膜のキャリア濃度の変調、及び、その非線形動的挙動	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-07 [2017/8/31-9/1]	浅野 哲也 パナソニック(株)
9	1030	34721	(調整作業)	サンビームでのXAFS測定環境の整備	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-28 [2017/8/31-9/1]	黒岡 和巳 パナソニック(株)
7	1031	34026	2014B5120, 2015A5120 2015B5120, 2016A5120	高度解析技術による電池材料の解析	パナソニック技報 Vol.63 No.1 2017年5月号	井垣 恵美子 パナソニック(株)
9	1032	34775	2015A5100, 2015B5100 2016A5100, 2016B5100 2017A5100	走査型X線顕微鏡を用いたマイクロポグラフィーの検討	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) SO-3/S-06 [2017/8/31-9/1]	米山 明男 (株)日立製作所
9	1033	34776	2016A5400, 2016B5400 2017A5400	SiC-MOSFETのX線トポグラフィー評価	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-05 [2017/8/31-9/1]	小西 くみこ (株)日立製作所
9	1034	34258	2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410	PLZT薄膜の結晶性制御及びFRAM特性への影響	強誘電体応用会議(第34回) [2017/5/31-6/3]	Wensheng Wang 富士通セミコンダクター(株)
9	1035	34645	2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410	強誘電体PLZTの結晶化メカニズム	秋季 応用物理学学会学術講演会 [2017/9/5-8]	野村 健二 (株)富士通研究所
9	1036	34762	2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410	IoT市場向け強誘電体メモリ(FRAM)におけるPLZT薄膜の結晶化メカニズム	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) SO-2/S-03 [2017/8/31-9/1]	野村 健二 (株)富士通研究所
9	1037	34765	2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410	人工光合成用Ga _N -ZnOナノ粒子アノード電極膜のXAFS/HAXPESによる分析	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-04 [2017/8/31-9/1]	淡路 直樹 (株)富士通研究所
9	1038	34794	2016A5430, 2017A5430	放射光トポグラフィによるSiC単結晶基板の評価	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-01 [2017/8/31-9/1]	中村 勇 三菱電機(株)
9	1039	34795	2016A5130, 2016B5130	硬X線光電子分光法による酸化膜/Si基板界面の欠陥密度評価	第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) SO-1/S-02 [2017/8/31-9/1]	田中 政幸 三菱電機(株)
5	1040	32980	2016A5130, 2016A5131	Correlation between Electronic Structure of SiN/AlGa _N Interface and Gate Leakage Current	第304回電機材料技術懇談会 発表奨励賞 [2017/1]	倉橋 健一郎 三菱電機(株)
9	1041	34793	2016B5131	酸化アルミニウム薄膜の構造及び電子状態解析	第53回X線分析討論会 [2017/10]	本谷 宗 三菱電機(株)

編集後記

日本は今、比較的平穏だった平成から、次の新しい時代に移ろうとしています。SPring-8 では次期計画に向けた議論が活発になってきています。また、サンビーム共同体は第Ⅱ期契約期の満了を迎え、第Ⅲ期契約期が始まろうとしています。このような新しい時代の到来に向け、サンビーム共同体には一層の飛躍が求められています。これに応えるため、サンビーム共同体は、「活動トピックス」で述べたように、第Ⅲ期に向けた様々な準備を進めて参りました。「サンビーム年報・成果集 vol.7」は、この変化の過渡期に発刊されることになりました。本成果集は、各社の放射光利用実験から得られた成果を広く世の中に公表することを目的としており、SPring-8 成果審査委員会により「公開技術報告書」として認定されています。近年、サンビーム共同体は、より大きな成果を得るためには外部との連携が益々重要になると考えていますが、本成果集は、外部の優れた研究者に各社の技術力を理解頂くための有効なツールと考えております。また、各社のプレゼンス向上に有効な査読論文の執筆のためのステップとしても活用されております。サンビーム共同体の今年度の基本方針には、「今後我が国が直面する様々な社会問題をテクノロジーで解決し、ゆとりある豊かな社会を実現する」ことを掲げましたが、本成果集もこの方針に則って、各社が放射光利用実験をどのような事業に役立て、どのように社会に貢献しようとしているかについても、記述することを心掛けました。

今後、サンビーム共同体の一層の飛躍に向け、本成果集をはじめとして、より広く成果を公開して参りますので、引き続き、ご指導、ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

サンビーム共同体 2017 年度合同部会長・編集委員長
三菱電機株式会社 河瀬和雅

サンビーム年報・成果集 Vol. 7 2017

2018年3月 発行

発行 サンビーム共同体(正式名称:産業用専用ビームライン建設利用共同体)

編集 サンビーム共同体編集委員会

編集委員長	河瀬 和雅	三菱電機(株)
副編集委員長	吉木 昌彦	(株)東芝
	出口 博史	電カグループ(関西電力(株))
編集委員	塚田 一郎	電カグループ((一財)電力中央研究所)
	小森 和彦	サンビーム共同体事務局

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1

公益財団法人 高輝度光科学研究センター内

産業用専用ビームライン建設利用共同体事務局

電話:0791-58-1839 FAX:0791-58-1830

URL:<https://sunbeam.spring8.or.jp>

印刷 (株)佐藤印刷所

著作権法に基づき、本書のいかなる形式の複製または転載も、
当該箇所の著作者による事前の許可が必要です。



産業用専用ビームライン建設利用共同体

SUNBEAM Consortium